

低真空走査型電子顕微鏡システム



性能及び仕様

製造所: 日本電子(株)

型 式: JSM-6610LV

導入年度: 平成21年度

仕 様:

観察真空度: 250Pa以上

分解能: 高真空時の保証分解能3.0nm(30kV)

低真空時の保証分解能4.0nm(30kV)

観察倍率: 5倍～30万倍

電子線加速電圧: 0.3kV～30kV

試料移動範囲: x方向125mm、y方向100mm、z方向80mm

最大試料寸法: 直径200mm

反射電子検出: 組成像、凹凸像、立体像が観察可能

元素分析: エネルギー分散型X線検出器(EDS)Be～U
の範囲の元素が検出可。

用途

材料表面形態の高分解能観察および成分分析、異物の元素同定などに用いる。